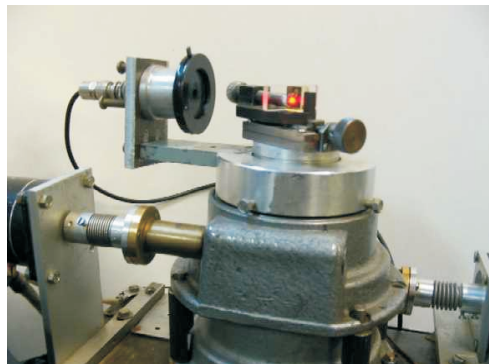




**НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ**

**ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
СТРУКТУР**



**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Используется в оптическом приборостроении для контроля параметров тонкопленочных покрытий при производстве интегральных схем, изготовлении оптических волноводов, дисплеев, тонкопленочных полимерных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Определение показателя преломления с точностью 10^{-4} .
Неограниченный выбор комбинации пленка-подложка.
Определение показателя преломления и коэффициента поглощения объемных металлов.
Измерение коэффициента поглощения $> 2 \text{ см}^{-1}$ для пленки толщиной менее 1 мкм.
Контроль параметров световых пучков.

**КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Оборудование и программный продукт.

РАЗРАБОТЧИК

Хомченко Александр Васильевич

**КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ**

Тел. (+375 222) 25-36-74
Факс (+375 222) 25-10-91
E-mail: market@bru.mogilev.by
www.bru.mogilev.by (раздел “Наука”)